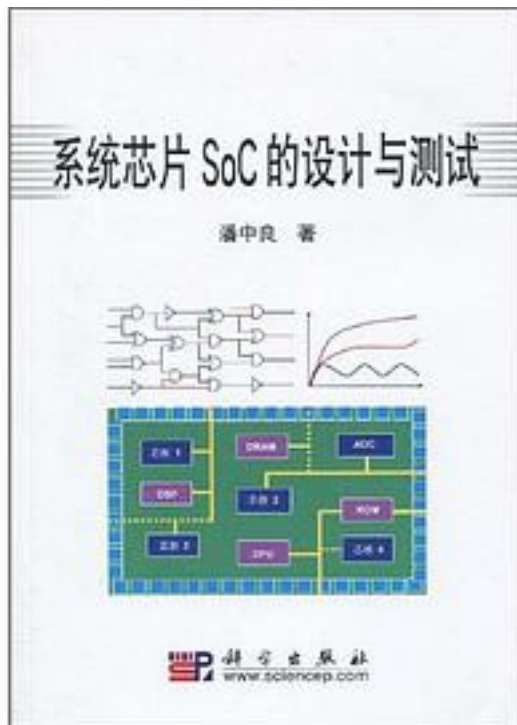


系统芯片SoC的设计与测试



[系统芯片SoC的设计与测试 下载链接1](#)

著者:潘中良

出版者:

出版时间:2009-10

装帧:

isbn:9787030256720

《系统芯片SoC的设计与测试》内容简介：系统芯片SoC能实现一个系统的功能，它是从整个系统的功能和性能出发，采用软硬结合的设计和验证方法，利用芯核复用及深亚微米技术，在一个芯片上实现复杂的功能。系统芯片具有速度快、集成度高、功耗低等特点。《系统芯片SoC的设计与测试》详细介绍了系统芯片SoC的设计与测试的关键技术和主要方法。全书共15章，内容包括：系统芯片的设计模式与流程、系统芯片的总线结构、芯核设计、软硬件协同设计、系统芯片的存储系统设计、系统芯片中模拟/混合信号的设计、系统芯片的低功耗设计、信号完整性、系统芯片的验证、系统芯片的可测性设计、测试调度与测试结构的优化设计、芯核的测试、系统芯片的物理设计、片上网络等。

《系统芯片SoC的设计与测试》可作为电子、通信、计算机、自动控制等学科高年级本科生和研究生的教材，也适合于从事电子信息、数字系统设计、测试和维护等相关专业的研究人员、工程技术人员学习参考。

作者介绍:

目录:

[系统芯片SoC的设计与测试_下载链接1](#)

标签

评论

[系统芯片SoC的设计与测试_下载链接1](#)

书评

[系统芯片SoC的设计与测试_下载链接1](#)